

Z軸駆動光学ソリューション

SAKIの3D-AOI Z軸駆動光学ソリューションは
2D/3D検査の拡張性を高め、
検査計測精度と生産品質の向上に貢献します。



昨今、電子機器製造業界では基板の複雑化が急速に進んでおり、それに伴い基板検査の多様なニーズが生じています。SAKIの3D-AOI Z軸駆動光学ソリューションは以下の検査課題を解決します。

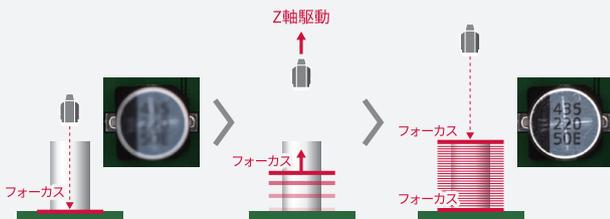
- 背高部品の文字と極性検査
- 背高部品やプレスフィットピンの高さ計測
- フレキシブル基板などの基板反り
- 治具運用やモジュール基板検査



Z軸駆動光学ソリューション 4つの拡張性

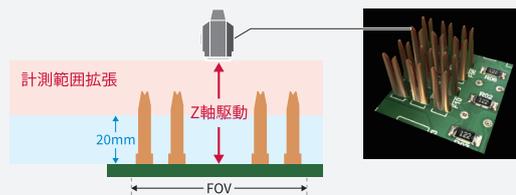
フォーカスレンジの拡張

Z軸ソリューション搭載により、基板面と背高部品上面の両方にフォーカスを合わせることができます。文字（OCR、OCV）や極性検査の検査精度が向上します。



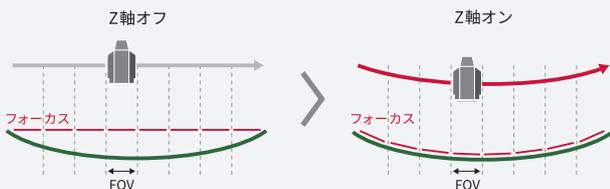
高さ計測範囲の拡張

高さ計測範囲は最大40mmまで拡張します。複数撮像画像を合成する独自技術により、はんだ面と背高部品両方の同時高さ計測を実現します。さらに、プレスフィットピンの高精度高さ計測も可能です。



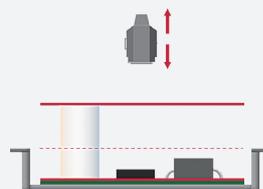
リアルタイム基板反り補正

基板反りに対し、Z軸ソリューションを追加することで、リアルタイムに基板面高さの追従と補正が可能です。レーザーなどのハードウェア追加は不要で、基板の上反りや2mm以上の基板反りにも対応します。



治具搬送検査に対応

基板面高さの異なる治具搬送検査に対応し、各々の基板面高さに合わせた撮像を行います。基板レイール高さからマイナス15mmまでZ軸駆動範囲が拡張されます。3D AOIの後工程拡張など、幅広い用途に適用可能です。



※Z軸は工場出荷オプションです。

